FAIRCHILD™

Is Now Part of

ON Semiconductor®

To learn more about ON Semiconductor, please visit our website at www.onsemi.com

Please note: As part of the Fairchild Semiconductor integration, some of the Fairchild orderable part numbers will need to change in order to meet ON Semiconductor's system requirements. Since the ON Semiconductor product management systems do not have the ability to manage part nomenclature that utilizes an underscore (_), the underscore (_) in the Fairchild part numbers will be changed to a dash (-). This document may contain device numbers with an underscore (_). Please check the ON Semiconductor website to verify the updated device numbers. The most current and up-to-date ordering information can be found at www.onsemi.com. Please email any questions regarding the system integration to Fairchild_questions@onsemi.com.

FAIRCHILD

2015 年 3 月

FCP130N60

N- 沟道 SuperFET® II MOSFET
600 V, 28 A, 130 mΩ

特性

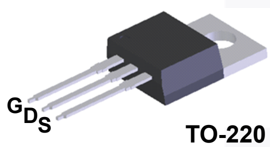
- 650 V @ T_J = 150 °C
- 典型值 $R_{DS(on)}$ = 112 mΩ
- 超低栅极电荷 （典型值 Q_g=54 nC）
- 低有效输出电容 （典型值 $C_{oss(eff.)}$= 240 pF）
- 100% 经过雪崩测试
- 符合 RoHS 标准

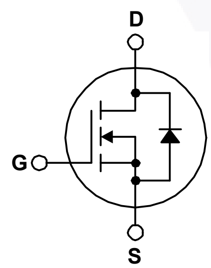
应用

- 通信 / 服务器电源
- 工业电源

描述

SuperFET® II MOSFET 是飞兆利用电荷平衡技术实现出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能的全新高压超级结 (SJ) MOSFET 系列产品。这项先进技术专用于最小化传导损耗，提供卓越的开关性能，并能够承受极端 dv/dt 额定值和更高雪崩能量。因此，SuperFET II MOSFET 适用于系统小型化和高效化的各种各样的 AC-DC 功率转换的应用中。





最大绝对额定值 T_C = 25 °C 除非另有说明。

符号	参数		FCP130N60	单位
V_{DSS}	漏极一源极电压		600	V
V_{GSS}	栅极一源极电压	- DC	±20	V
		- AC (f > 1 Hz)	±30	
I_D	漏极电流	- 连续 （TC = 25 °C）	28	A
		- 连续 （T_C = 100 °C）	18	
I_{DM}	漏极电流	- 脉冲 （注 1）	84	A
E_{AS}	单脉冲雪崩能量 （注 2）		720	mJ
I_{AR}	雪崩电流 （注 1）		6	A
E_{AR}	重复雪崩能量 （注 1）		2.78	mJ
dv/dt	MOSFET dv/dt		100	V/ns
	二极管恢复 dv/dt 峰值 （注 3）		20	
P_D	功耗	(T_C = 25 °C)	278	W
		- 高于 25 °C 的功耗系数	2.2	W/°C
T_J, T_{STG}	工作和存储温度范围		-55 至 +150	°C
T_L	用于焊接的最大引脚温度，距离外壳 1/8”，持续 5 秒		300	°C

热性能

符号	参数	FCP130N60	单位
$R_{\theta JC}$	结至外壳热阻最大值	0.45	°C/W
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻最大值	40	

封装标识与定购信息

器件编号	顶标	封装	包装方法	卷尺寸	带宽	数量
FCP130N60	FCP130N60	TO-220	塑料管	不适用	不适用	50 个

电气特性 T_C = 25 °C 除非另有说明。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
关断特性						
BV_{DSS}	漏极-源极击穿电压	V_{GS} = 0 V, I_D = 10 mA, T_J = 25 °C	600	-	-	V
		V_{GS} = 0 V, I_D = 10 mA, T_J = 150 °C	650	-	-	
$\Delta BV_{DSS} / \Delta T_J$	击穿电压温度系数	I_D = 10 mA，参考 25 °C 数值	-	0.67	-	V/°C
I_{DSS}	零栅极电压漏极电流	V_{DS} = 600 V, V_{GS} = 0 V	-	-	1	μA
		V_{DS} = 480 V, V_{GS} = 0 V, T_C = 125 °C	-	1.3	-	
I_{GSS}	栅极-体漏电流	V_{GS} = ±20 V, V_{DS} = 0 V	-	-	±100	nA
导通特性						
$V_{GS(th)}$	栅极阈值电压	V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250 μA	2.5	-	3.5	V
$R_{DS(on)}$	漏极至源极静态导通电阻	V_{GS} = 10 V, I_D = 14 A	-	112	130	mΩ
g_{FS}	正向跨导	V_{DS} = 20 V, I_D = 14 A	-	26	-	S
动态特性						
C_{iss}	输入电容	V_{DS} = 380 V, V_{GS} = 0 V, f = 1 MHz	-	2700	3590	pF
C_{oss}	输出电容		-	65	85	pF
C_{rss}	反向传输电容		-	2.85	-	pF
$C_{oss(eff.)}$	有效输出电容	V_{DS} = 0 V 至 480 V, V_{GS} = 0 V	-	240	-	pF
$Q_{g(tot)}$	10 V 的栅极电荷总量	V_{DS} = 380 V, I_D = 14 A, V_{GS} = 10 V（注 4）	-	54	70	nC
Q_{gs}	栅极-源极栅极电荷		-	12	-	nC
Q_{gd}	栅极-漏极 " 米勒 " 电荷		-	14	-	nC
ESR	等效串联电阻	f = 1 MHz	-	1	-	Ω
开关特性						
$t_{d(on)}$	导通延迟时间	V_{DD} = 380 V, I_D = 14 A, V_{GS} = 10 V, R_g = 4.7 Ω（注 4）	-	25	60	ns
t_r	导通上升时间		-	16	42	ns
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		-	65	140	ns
t_f	关断下降时间		-	4	18	ns
漏极-源极二极管特性						
I_S	漏极-源极二极管最大正向连续电流		-	-	28	A
I_{SM}	漏极-源极二极管最大正向脉冲电流		-	-	84	A
V_{SD}	漏极-源极二极管正向电压	V_{GS} = 0 V, I_{SD} = 14 A	-	-	1.2	V
t_{rr}	反向恢复时间	V_{GS} = 0 V, I_{SD} = 14 A, dI_F/dt = 100 A/μs	-	376	-	ns
Q_{rr}	反向恢复电荷		-	7.6	-	μC

注:

1. 重复额定值：脉冲宽度受限于最大结温。
2. I_{AS} = 6 A， V_{DD} = 50 V， R_G = 25 Ω，开始于 T_J = 25 °C。
3. $I_{SD} \leq$ 14 A， di/dt ≤ 200 A/μs， $V_{DD} \leq BV_{DSS}$，开始于 T_J = 25 °C。
4. 典型特性本质上独立于工作温度。

典型性能特征

图 **1.** 导通区域特性

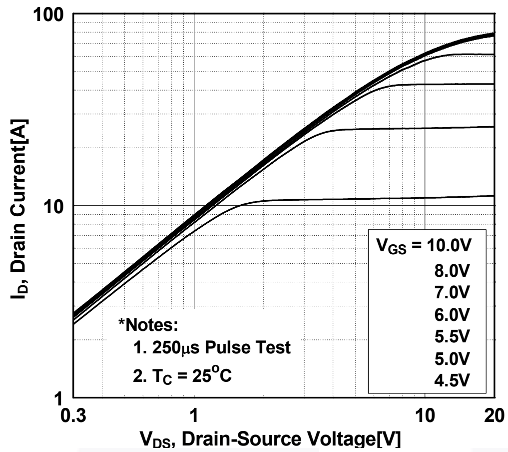


图 **2.** 传输特性

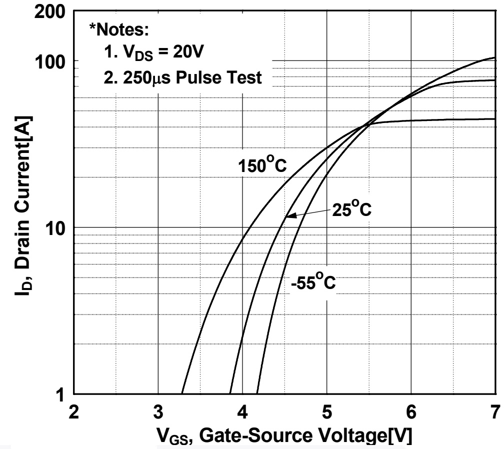


图 **3.** 导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系

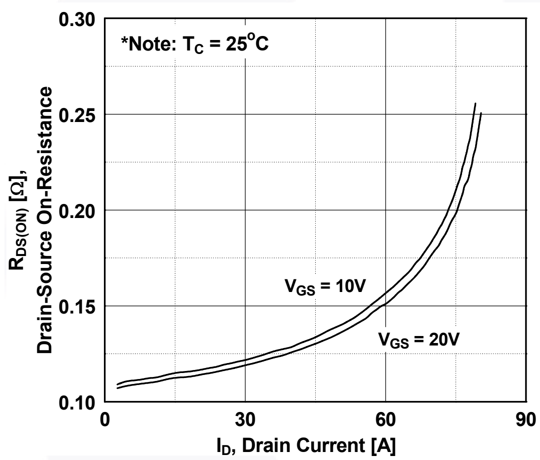


图 **4.** 体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系

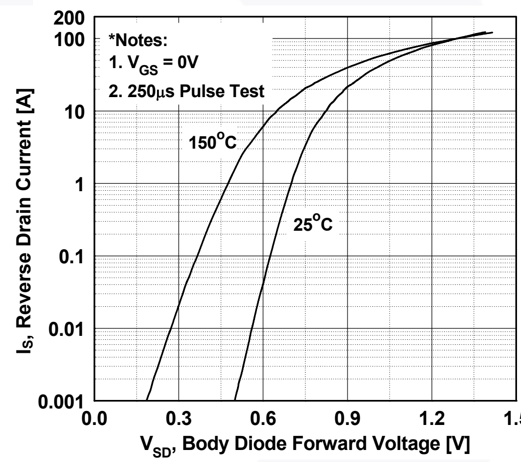


图 **5.** 电容特性

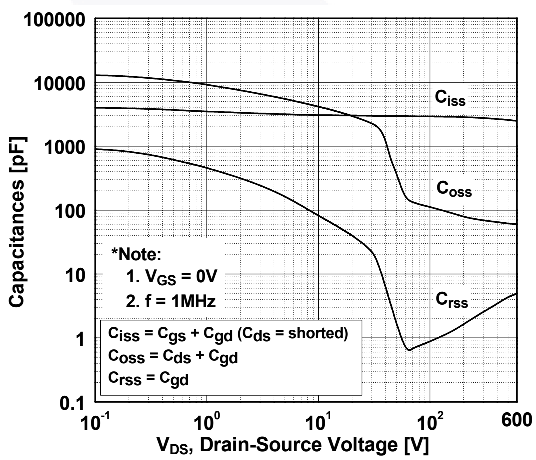
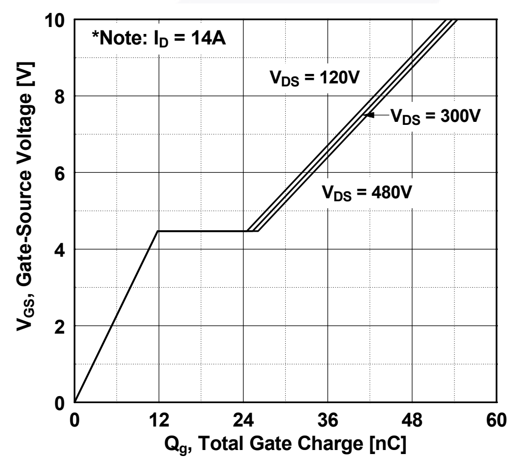


图 **6.** 栅极电荷特性



典型性能特征（接上页）

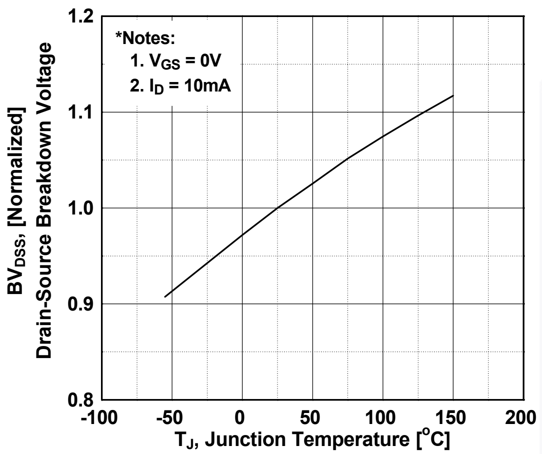


图 **7.** 击穿电压变化与温度的关系

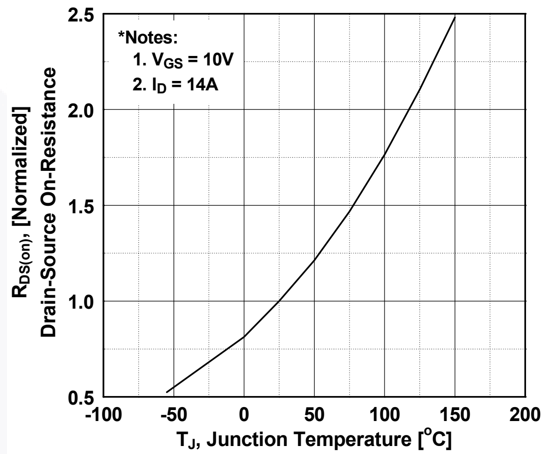


图 **8.** 导通电阻变化与温度的关系

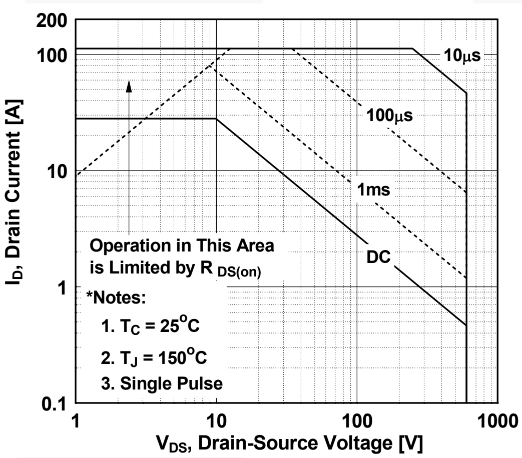


图 **9.** 最大安全工作区

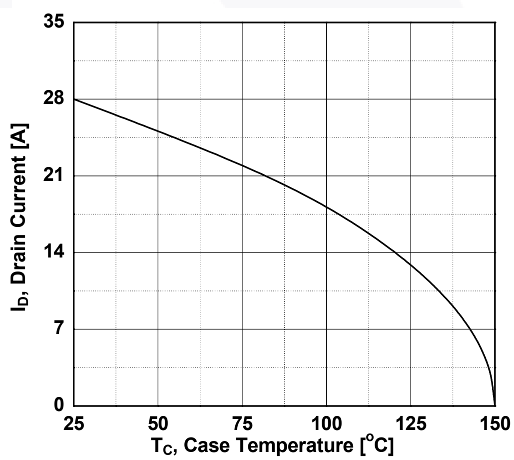


图 **10.** 最大漏极电流与壳温的关系

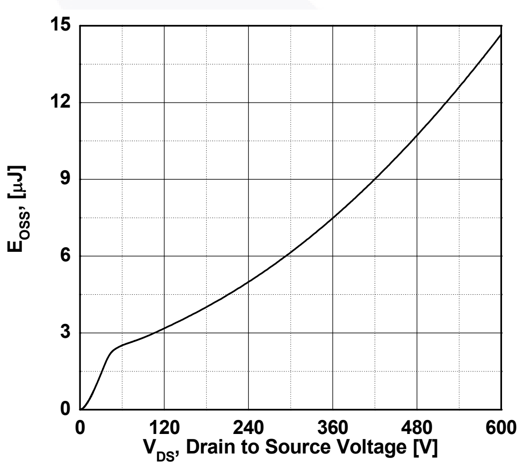


图 **11. Eoss** 与漏源极电压的关系

典型性能特征（接上页）

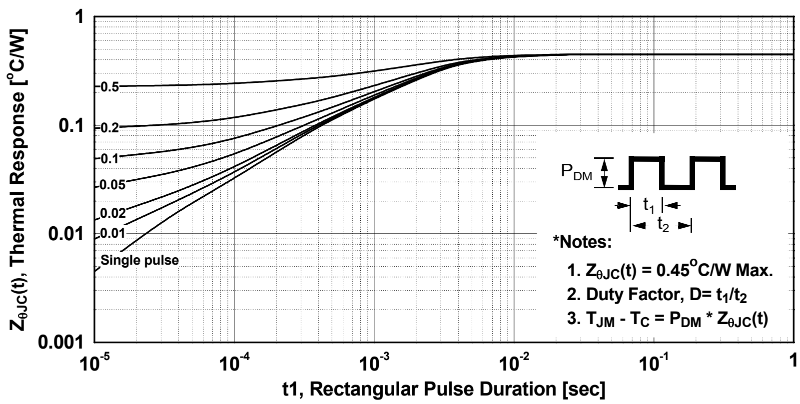


图 12. 瞬态热响应曲线

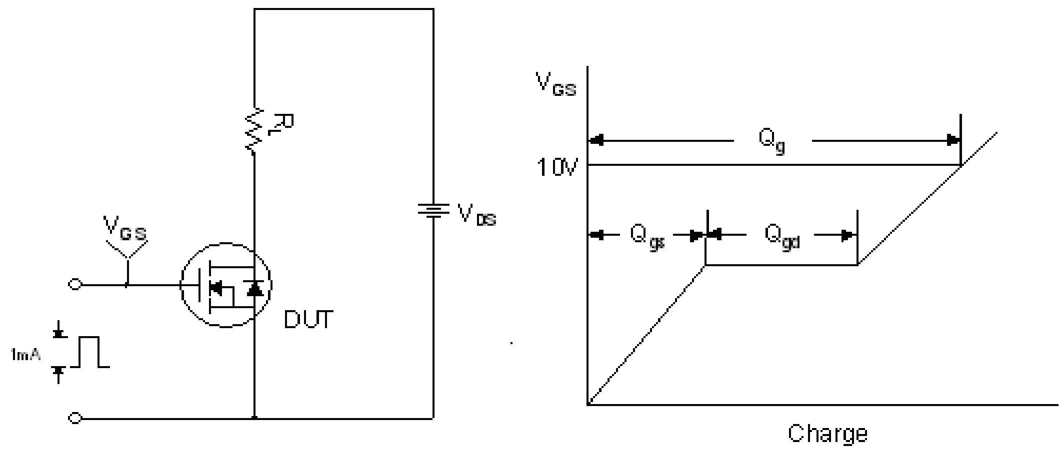


图 **13.** 栅极电荷测试电路与波形

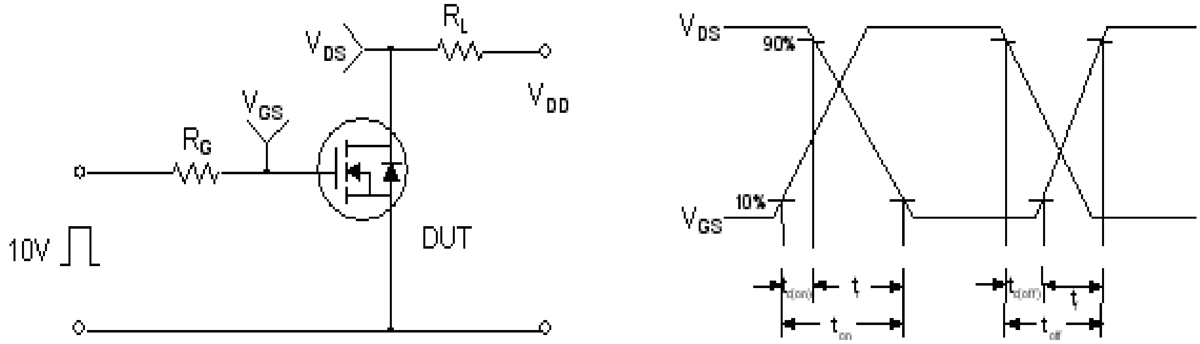


图 **14.** 阻性开关测试电路与波形

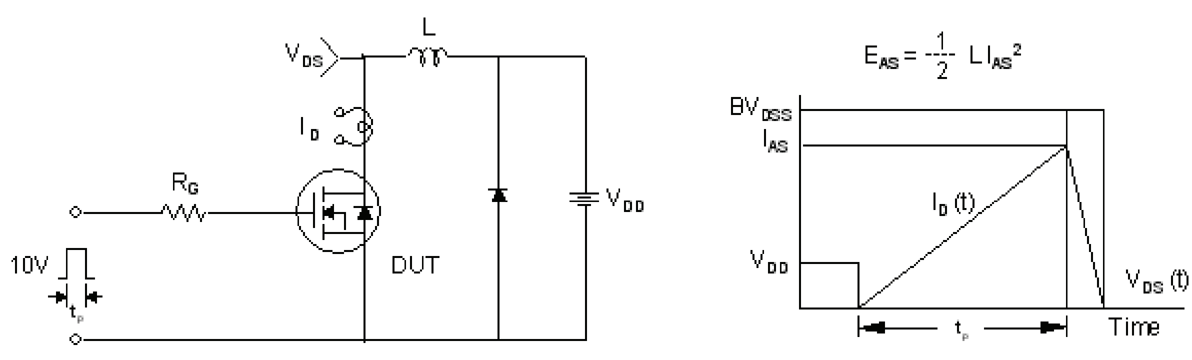


图 **15.** 非箝位电感开关测试电路与波形

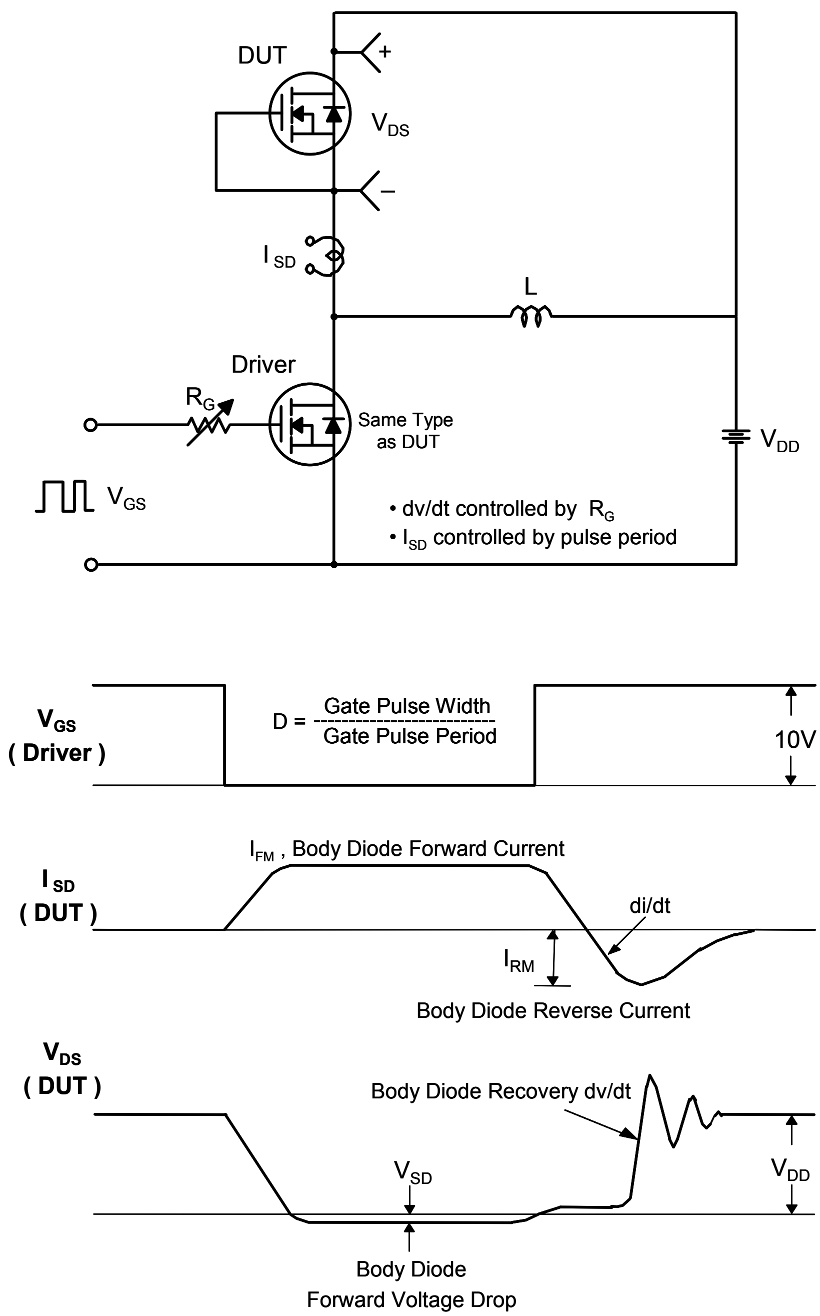
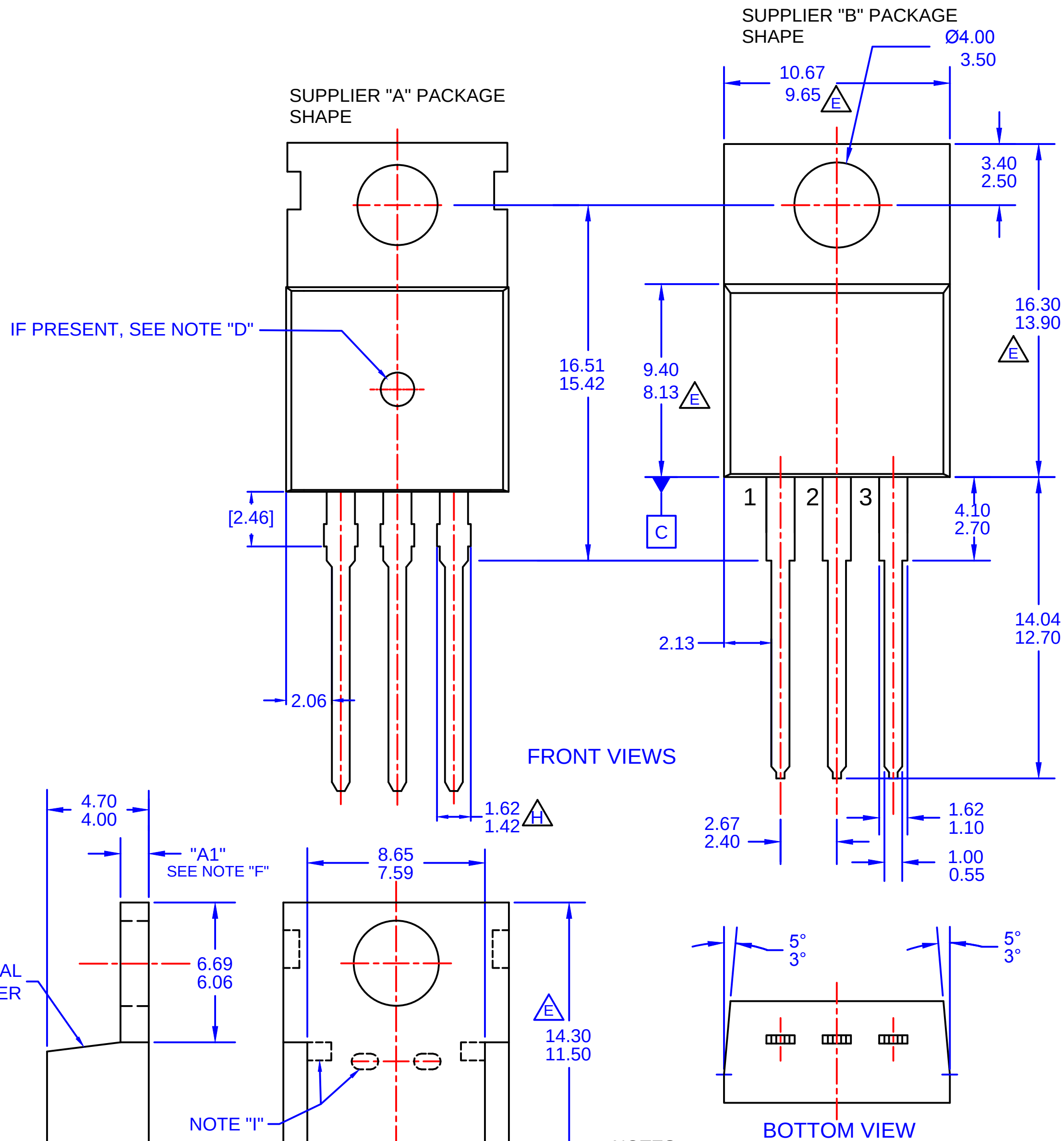
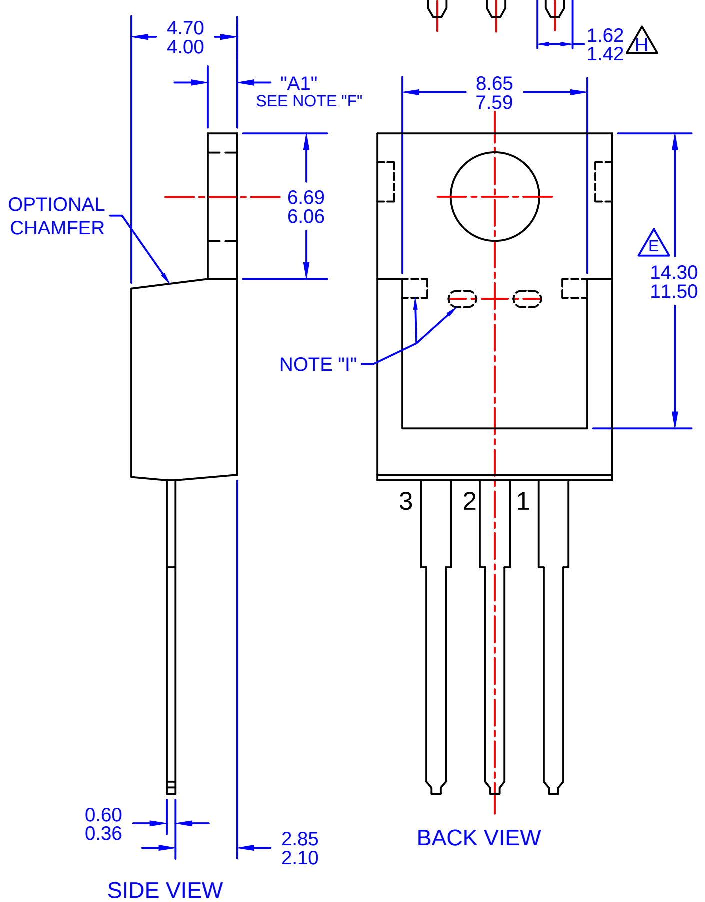


图 **16.** 二极管恢复 **dv/dt** 峰值测试电路与波形





NOTES:

A) REFERENCE JEDEC, TO-220, VARIATION AB
B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
C) DIMENSIONS COMMON TO ALL PACKAGE SUPPLIERS EXCEPT WHERE NOTED [ ].
D) LOCATION OF MOLDED FEATURE MAY VARY (LOWER LEFT CORNER, LOWER CENTER AND CENTER OF THE PACKAGE)
E) DOES NOT COMPLY JEDEC STANDARD VALUE.
F) "A1" DIMENSIONS AS BELOW:
SINGLE GAUGE = 0.51 - 0.61
DUAL GAUGE = 1.10 - 1.45
G) DRAWING FILE NAME: TO220B03REV9
H) PRESENCE IS SUPPLIER DEPENDENT
I) SUPPLIER DEPENDENT MOLD LOCKING HOLES IN HEATSINK.

FAIRCHILD™

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:
Literature Distribution Center for ON Semiconductor
19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA
Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910
Japan Customer Focus Center
Phone: 81−3−5817−1050

ON Semiconductor Website: **www.onsemi.com**

Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit

For additional information, please contact your local Sales Representative